

2025年1月28日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード)
代表者名：代表取締役 姜 輝
問合せ先：経営企画室長 鎌田 文明
(TEL：045-317-7888)

ウエハ・アクセプタンス・テスト(WAT) 検査装置「WTS-511」リリース、販売開始のお知らせ

この度、ウインテスト株式会社（横浜市西区）は、ウエハ・アクセプタンス・テスト（WAT）検査装置「WTS-511」を2025年2月より正式にリリースし、販売開始いたします。

記

1. ウエハ・アクセプタンス・テスト（WAT）は、半導体製造工場で完成したウエハ上で行う電氣的検査で、設計基準や顧客要求を満たしているか出荷される前の最終的な品質保証プロセスです。これにより、不具合の早期発見や工程の最適化が可能となり、歩留まり向上に寄与します。また、不良品の出荷防止と顧客満足度の向上が期待できます。これらの検査は、製造工程の品質管理と製品信頼性確保の要となる重要な工程です。WAT検査装置は、上記の電氣的検査を実現するための不可欠な装置となります。

半導体デバイスの自動検査について、大きく下記のように分類されます。

- WAT (Wafer Acceptance Test) テスト
- CP (Chip Probing) テスト
- FT (Final Test) テスト
- SLT (System Level Test) テスト

当社はこれまでデザインハウス（ICの設計会社）及びOSAT^注向けのCP検査装置及びFT検査装置の開発、販売をしてまいりましたが、今後ウエハの製造工場向けのWAT検査装置を販売いたします。

注：「Outsourced Semiconductor Assembly and Test」の略で、半導体の組立やテストといったいわゆる半導体製造の“後工程”を専門とする企業。

日本の半導体産業が復活し、半導体製造工場の建設と設備投資は加速しています。当社は、日本の半導体産業復活に貢献できるように微力ながら尽力いたします。

2. WTS-511の特徴

WTS-511検査装置は、高速の並列アーキテクチャと柔軟なチャネルごとのリソースにより、業界をリードするスループットを実現します。特に、高密度スクライブ アレイ ベースのテスト構造や個別のシングル パッド付きDUT（Device Under Test、被試験デバイス）に適して

います。従来の LCR ベースの静電容量測定技術に代わる高度な並列化として、すべてのチャンネルで直接電荷測定が利用できる利点があります。

主な特徴

- 変動スクリーニングと欠陥監視
- スクライブ ラインのウエハ・アクセプタンス・テスト（WAT）およびプロセス制御モニタリング（PCM）
- 個別DUTとアレイDUTの両方に柔軟に対応
- 全チャンネル同時並列動作
- 従来のLCRベースの容量測定技術に代わる高度な並列化として、すべてのチャンネル（フォースまたは測定）で直接電荷測定が利用可能

3. 業績に与える影響について

今期通期業績への影響について、現在精査中です。明確になり次第お知らせいたします。

※本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、諸般の事情により予告なく変更されることがあります。

以上

WTS-511のご紹介



WTS-511概観

主要諸元：

測定ピン	最大48ピン
SMU	最大8チャンネル、 $\pm 200V/\pm 100mA$, 360K samples/s $\sim$ 100M samples/s
PMU	最大64チャンネル、 $\pm 10V/\pm 20mA$
DCM/AWG/FMU	最大32チャンネル
LCR	1チャンネル
重量	MF : 160Kg ; TH : 350Kg
サイズ	MF : 700mm*1000mm*1000mm ; TH : 992mm*750mm*891mm